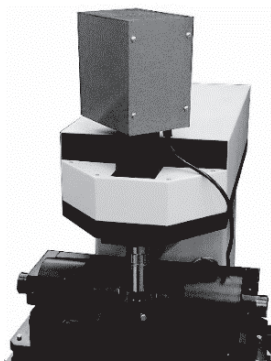


16bit偏光カメラ～偏光角／楕円率検出による磁区観察～

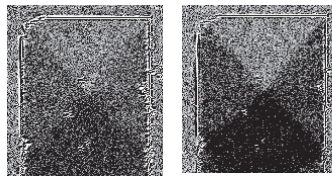
弊社と東北大学 斉藤 伸 教授との共同開発において、対象を直線偏光に限定した場合、2つの偏光成分を検出するだけで偏光角／楕円率角を得られることを見出しました。輝度16bit分解能センサーを2個用いた16bit偏光カメラを開発し、偏光角／楕円率角検出による高品位磁区観察を実現しています。楕円率角検出を可能にしたことにより従来観察困難だった試料の観察が可能となり、光源の光量変動に影響されない安定した磁区観察が期待できます。



＜観察例＞
NiFe薄膜パターン
白色LED光源観察

回転角像

楕円率像



本学術講演会19aA-9講演予定

－特長－

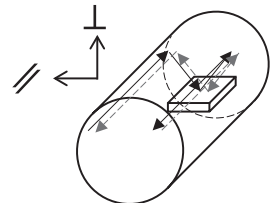
- 照明光の利用効率が高い
- 光源の光量変動の影響が小さい
- 反射率分布の影響が小さい
- 曲面の磁区観察可能
- 偏光角/楕円率角検出による広範な観察対象

－主な仕様－

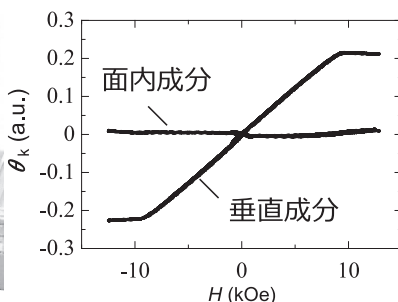
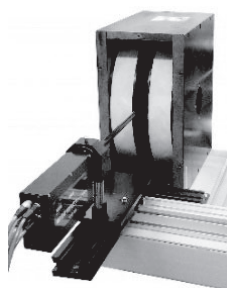
- 輝度分解能： 16 bit
- 画素サイズ： 4.8×4.8 μm
- 画素数： 1280×720
- 偏光角/楕円率角分解能： 0.002°以下
- OPC接続： USB-3.0

面内／垂直成分同時測定プローブKerrユニット

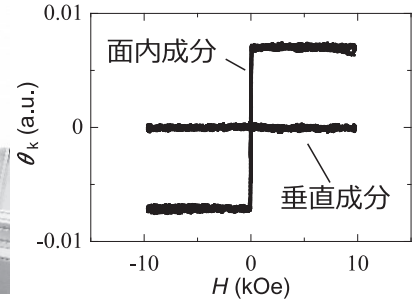
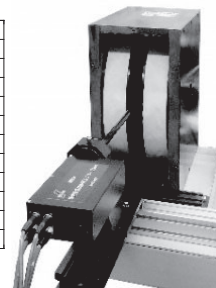
既設の電磁石を活用し、検出部を電磁石磁極間に配置して磁気光学Kerr効果を測定するユニット製品です。プローブ部の回転により垂直／面内磁場印加によるループ測定を可能としました。逆方向入射光学系による検出と演算処理により面内／垂直成分の同時測定が可能です。



測定例 サンプル：NiFe薄膜



垂直磁場印加測定



面内磁場印加測定

上記以外にも多種多様な製作実績有り！テストのご依頼等ぜひお気軽にお問合せください



ネオアーク株式会社

<https://www.neoark.co.jp/>

お問合せメールアドレス：info@neoark.co.jp

電話番号：042-627-7432 (東日本地区)

06-6271-5123 (西日本地区)